

FrontISTR接触解析プログラム解説 (カスタマイズ編)

富士通アドバンステクノロジー株式会社

構造技術統括部

稲垣和久

2016年11月28日

- FrontISTRの接触解析について、接触構造体や接触探索等を中心に、過去分と重複しない範囲で解説を行います
- 関連個所のカスタマイズ例を示します

- はじめに
- FrontISTR接触解析の概要
- 接触解析プログラムの解説
 - 接触構造体と接触探索を中心に
- カスタマイズ実施例
 - ログ出力
 - 表面ベースの結合拘束
 - 接触アルゴリズムの新設（内点法接触の紹介）

■ 少しでも宣伝

■ 弊社では、FrontISTRに電子機器向け各種機能追加を行って活用しています

- 特に接触解析を重点的に改良

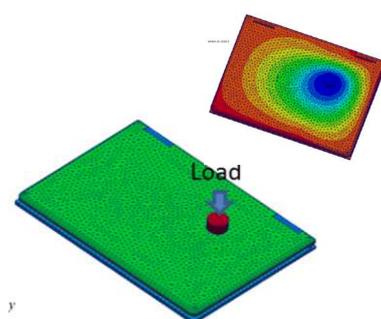
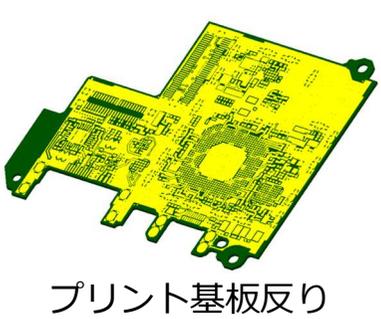
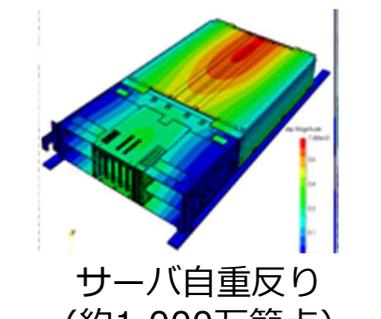
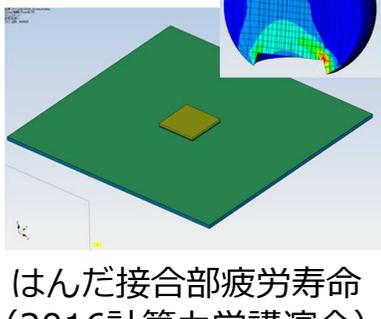
■ 弊社カスタマイズ版FrontISTR
「**FS-Solver**」

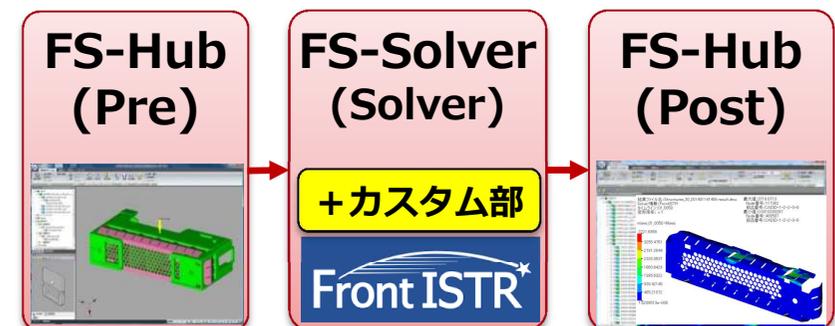
+ 独自統合解析環境「**FS-Hub**」
を提供中です

- どうぞよろしくお願い致します。

■ FrontISTR本体開発も行っています

- 回転・トルク荷重機能の開発
- 自動増分・カットバック機能開発 (予定)

静解析 : 機械的荷重	静解析 : 熱荷重
 <p>ノートPC圧迫・他 (2014 OpenCAE学会)</p>	 <p>プリント基板反り (2013計算工学講演会)</p>
 <p>サーバ自重反り (約1,000万節点)</p>	 <p>はんだ接合部疲労寿命 (2016計算力学講演会)</p>



FrontISTR接触解析の概要

■ 連続体の釣合方程式を...

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Omega^{(k)}, \quad \# \text{ 釣合方程式}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \quad \text{on } \Gamma_B^{(k)}, \quad \# \text{ 変位境界条件}$$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t} \quad \text{on } \Gamma_t^{(k)}, \quad \# \text{ 荷重境界条件}$$

■ 接触制約のもとで解く

■ 接触境界条件

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{t}_c \equiv t_N \mathbf{n} + \mathbf{t}_T \quad \text{on } \Gamma_c^{(k)},$$

■ 非貫入制約 (KKT条件)

$$g_N \geq 0, \quad \# \text{ 接触ギャップ}$$

$$t_N \leq 0, \quad \# \text{ 法線方向接触圧}$$

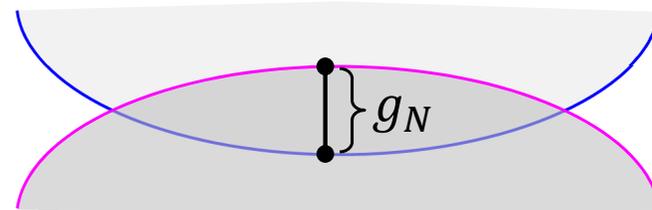
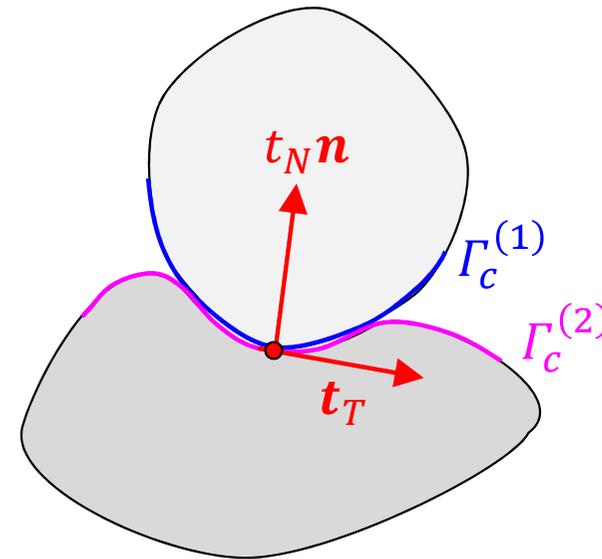
$$g_N t_N = 0,$$

■ 摩擦制約 (以降では省略)

$$\dot{\zeta} \geq 0, \quad \# \text{ 滑り速度}$$

$$\Phi(t_N, \mathbf{t}_T) \leq 0, \quad \# \text{ すべり限界関数}$$

$$\dot{\zeta} \Phi = 0.$$



g_N : 接触ギャップ (貫入時は負値)

- ギャップが0で接触圧が発生(>0)
 - ギャップが存在(>0)して接触圧が0
 のいずれかであることを意味している

■ 有限要素法による離散化

■ 仮想仕事式の導出

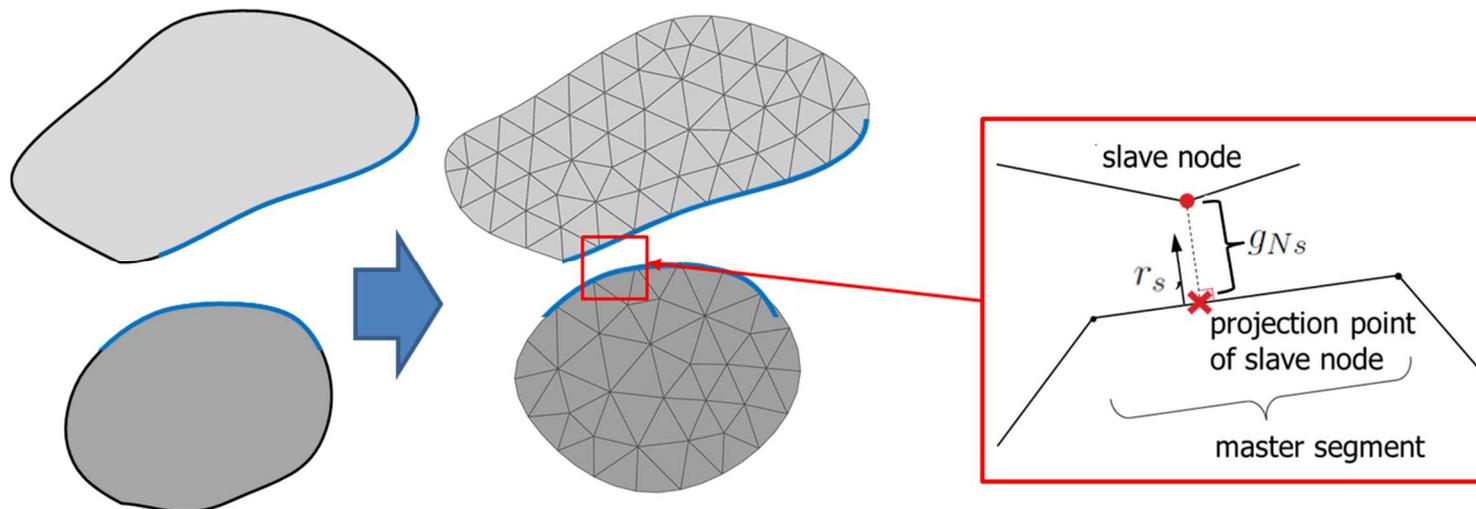
$$\sum_{k=1}^2 \int_{\Omega^{(k)}} \boldsymbol{\sigma} : \delta \mathbf{D} \, dv = \sum_{k=1}^2 \int_{\Omega^{(k)}} \rho \mathbf{g} : \delta \mathbf{u} \, dv + \sum_{k=1}^2 \int_{\Gamma_t^{(k)}} \mathbf{t} \cdot \delta \mathbf{u} \, ds + \sum_{k=1}^2 \int_{\Gamma_c^{(k)}} \mathbf{t}_c \cdot \delta \mathbf{u} \, ds$$

■ 連続体部分は、接触無しの場合と同様に有限要素離散化

接触の寄与

■ 接触の離散化…FrontISTRでは**Node to Surface**の離散化を行う

- 接触面対をマスター面、スレーブ面に区分
- スレーブ面の節点が、各マスター要素面に貫入しない



■ 離散化された接触条件

- 接触力、接触制約…スレーブ節点ごとに1つ

$$g_{N,s} \geq 0, t_{N,s} \leq 0, g_{N,s}t_{N,s} = 0$$

- 接触ギャップ

$$g_{N,s} \equiv (\mathbf{x}^{(s)} - \mathbf{x}^{(P)}) \cdot \mathbf{n}_s$$

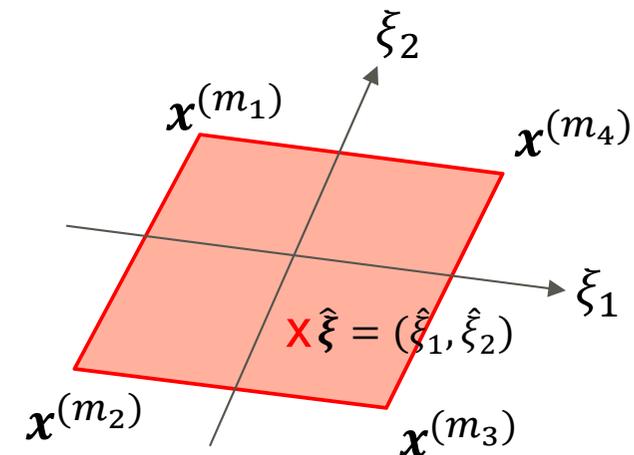
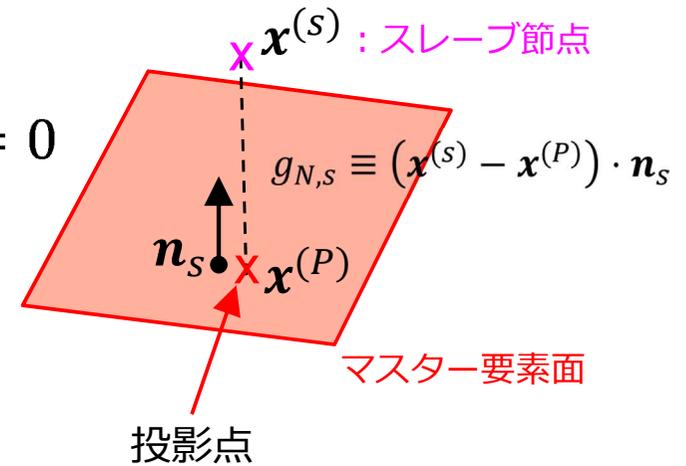
- $\mathbf{x}^{(s)}$: スレーブ節点座標
- $\mathbf{x}^{(P)}$: マスター投影点座標
- \mathbf{n}_s : 法線方向単位ベクトル

- マスター投影点座標

$$\mathbf{x}^{(P)} = \sum_{j=1}^{n_e} N_j(\hat{\xi}) \mathbf{x}^{(m_j)}$$

- $\hat{\xi}$: 投影点の要素面内座標
- N_j : 要素面の形状関数 (重み)
- $\mathbf{x}^{(m_j)}$: 要素面構成節点座標

- 法線方向… $\mathbf{x}^{(P)}$ の接ベクトルと直交する方向を計算 (詳細割愛)



■ 最終的に解くべき式は次の通り

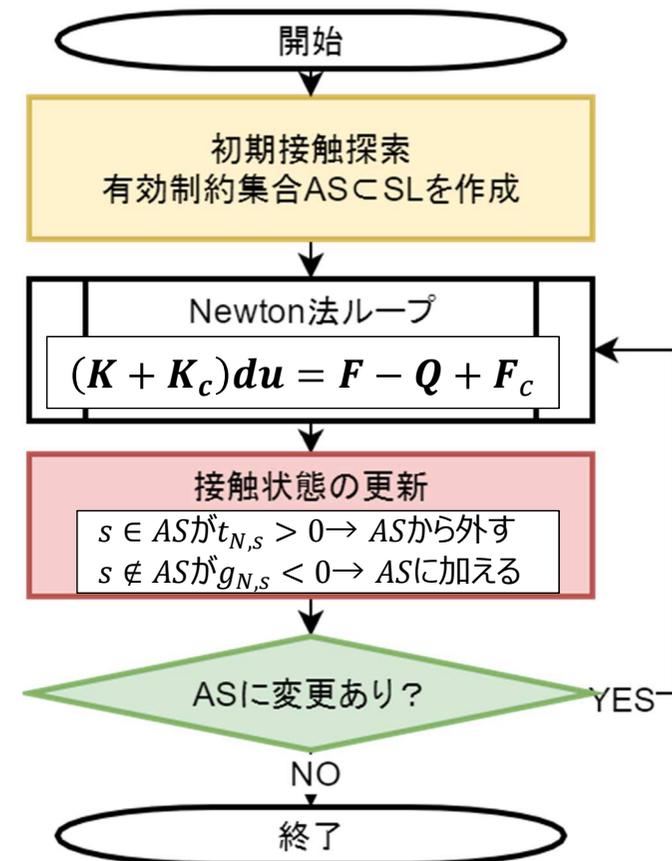
$$\begin{aligned} Q - F - F_c &= 0, \\ u &= u_0 \text{ on } \Gamma_B^{(k)}, \\ g_{N,s} &\geq 0, t_{N,s} \leq 0, g_{N,s}t_{N,s} = 0. (s \in SL) \end{aligned}$$

- Q : 内力、 F : 外力、 F_c : 接触力
- SL : スレーブ節点集合

■ 非貫入制約の処理

- FrontISTRでは**有効制約法**によって等式制約問題に帰着する
 - 貫入ギャップが0となるべきスレーブ節点集合 $AS \subset SL$ を、試行錯誤的に決定する
 - 各試行の中では等式制約問題。
FrontISTRでは**Lagrange乗数法**
または**拡張Lagrange乗数法**で解く
- 制約境界付近で発散するバリア関数を用い、不等式制約問題を直接解く方法もある

- # 接触力を含む釣合方程式
- # 変位境界条件
- # 非貫入制約



■ 基礎方程式

- 釣合方程式
- 非貫入制約
- 摩擦条件

■ 有限要素離散化

- 仮想仕事式
- 接触の離散化(Node to Surface)

■ 解法

- 接触状態の決定 (有効制約法)
- 等式制約条件付きNewton法 (Lagrange乗数法)
 - 接触剛性
 - 接触節点力
- 線形方程式の解法
 - 直接法
 - 反復法

■ プログラム

■ データ

- 接触情報 tContact
 - 接触状態 tContactState
 - 面情報 tSurfaceElement
- 接触剛性行列 hecMAT, conMAT

■ フロー

- メインループ
- 接触判定
 - 探索メインループ
 - 投影点探索
- 接触剛性
- 接触力
- 行列プロファイル更新

■ 並列化

赤字…本資料発表部分

それ以外の部分は下記の過去資料を参照ください

- 資料1: FrontISTRによる接触解析の理論とプログラムの解説 (ver.4.4), 第21回FrontISTRユーザ会
- 資料2: FrontISTRによる並列接触解析のプログラム解説(ver.4.4), 第23回FrontISTRユーザ会
- 資料3: 接触問題向け反復法線形ソルバーの解説と適用事例, 第21回FrontISTRユーザ会

接触解析プログラムの解説

- 接触構造体と接触探索を中心に

■ 接触ペアの構造体 : tContact

■ !CONTACT 1つにつき1つ

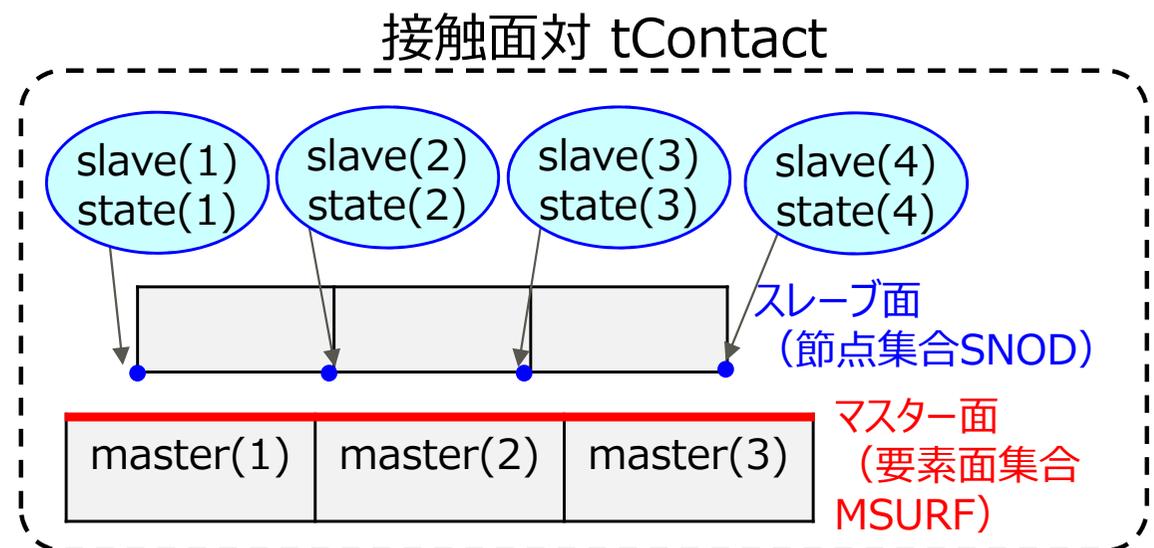
■ 定義 : lib/contact/fstr_contact_def.f90

■ 主な変数

- スレーブ節点番号 : integer :: slaves(:)
- スレーブ節点情報 : type(tContactState) :: states(:)
- マスター面構成情報 : type(tSurfEelemt) :: master(:)
- 接触特性情報 : ctype (接触タイプ) , fcoeff (摩擦係数) など

【メッシュファイル】
!NGROUP, NGRP=**SNOD**
!SGROUP, SGRP=**MSURF**
!CONTACT PAIR, NAME=CP1
SNOD, MSURF

【解析制御ファイル】
!CONTACT
CP1, 0.2



■ fstr_info_contactChange

■ 接触状態の変化に関する統計情報

■ 定義：lib/contact/fstr_contact_def.f90

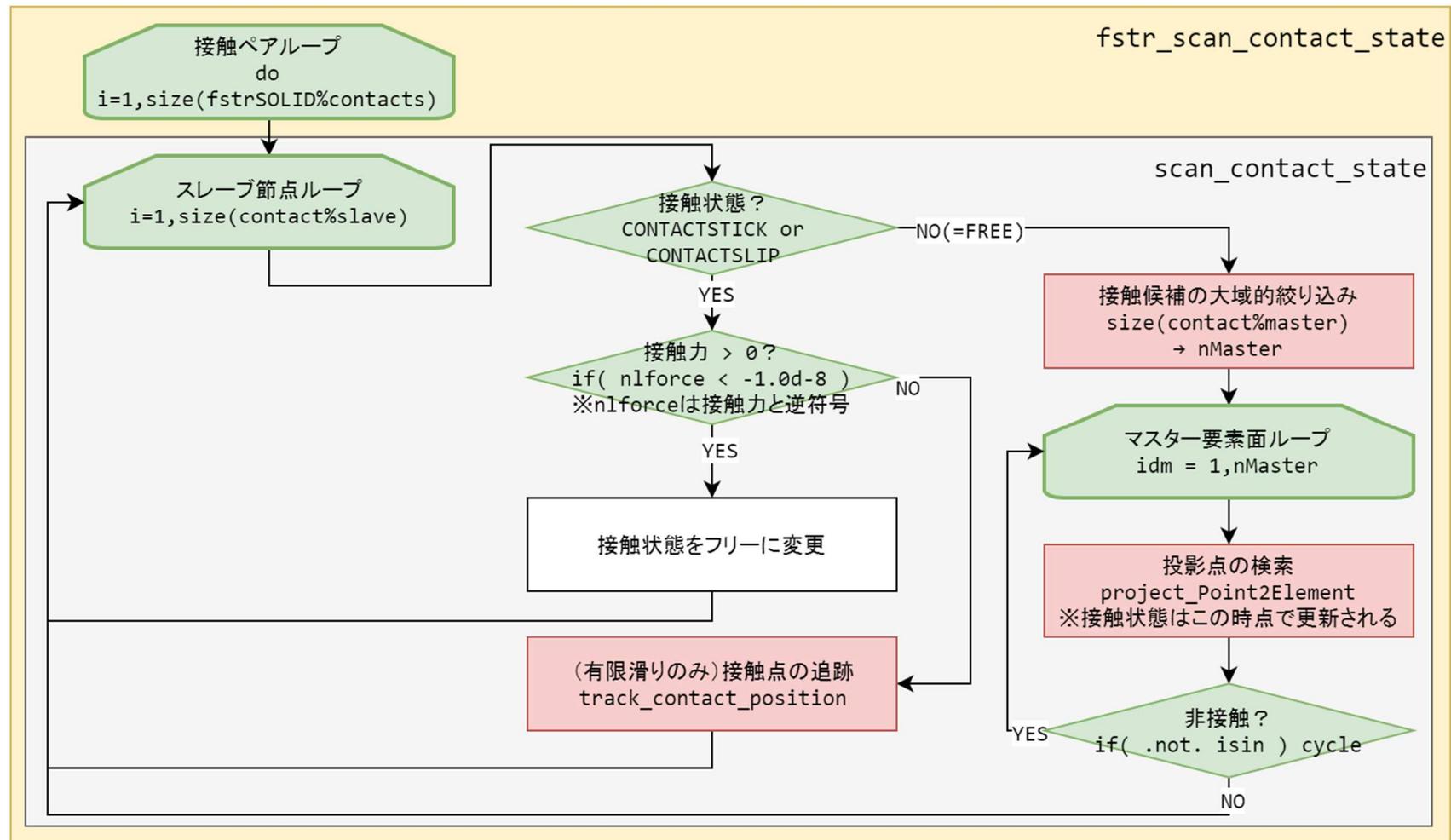
■ 主な変数（すべてint）

- contact2free : 接触からフリーに変化した数
- contact2neighbor : （有限滑りのみ）隣接要素に移動した数
- contact2diffLpos : （有限滑りのみ）要素内で閾値以上に変位した数
- free2contact : フリーから接触に変化した数
- contactNode_previous : 前反復での接触数
- contactNode_current : 現在の接触数

■ fstr_scan_contact_state : 接触探索のメイン関数

■ 定義 :

- common/fstr_contact.f90
- lib/contact/fstr_contact_def.f90 (scan_contact_state)



接触解析のカスタマイズ例

【例1】接触状態のモニタリング

■ 接触状態の統計情報（時系列出力）

- デフォルトの接触ログは、個別の接触状態の変化が全部出力される
- 接触点数が多いときは、統計情報がほしい
- fstr_info_contactChangeの内容を毎時出力するだけ
 - 一方で、scan_contact_stateにあるスレーブ節点ごとの出力は削除してもよい

```
subroutine print_analysis_status( infoCTChange )
  type (fstr_info_contactChange), intent(in) :: infoCTChange

  logical, save :: header_flag = .false.
  integer(kind=kint) :: c2f, f2c, cnt, mg, ml

  c2f = infoCTChange%contact2free
  f2c = infoCTChange%free2contact
  cnt = infoCTChange%contactNode_current
  mg = infoCTChange%contact2neighbor
  ml = infoCTChange%contact2diff1pos

  write(IDBG, '(9I8)') cstep, sub_step, c_iter, n_iter, f2c, c2f, cnt, mg, ml

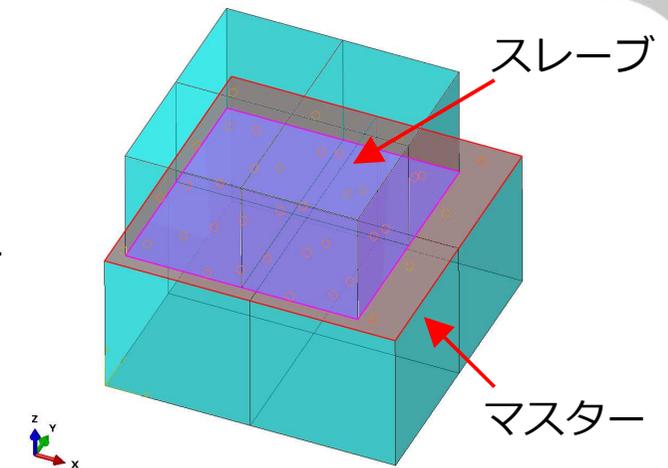
end subroutine
```

【例2】表面ベースの結合拘束

■ 対向する表面同士のコ合

■ どんな機能か

- 対向する2つの面（マスター面とスレーブ面）を与えるときスレーブ面内の各節点について、その変位がマスター面投影点の変位と一致するよう拘束する（MPC）
$$\mathbf{u}^{(s)} = \mathbf{u}^{(P)} = N_1 \mathbf{u}^{(m_1)} + N_2 \mathbf{u}^{(m_2)} + \dots + N_k \mathbf{u}^{(m_k)}$$
$$N_i : \text{補間関数@投影点}$$

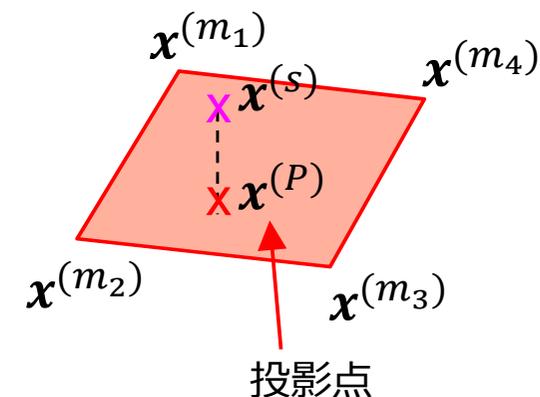


- FrontISTRは!EQUATIONカードでスレーブ節点の各自由度ごとにMPCの係数 N_i を入力する必要がある（大変）

!EQUATION

-1, N_1 , N_2 , ..., N_k

...



- 接触と同じような入力で、面対のコ合がしたい（係数の算出などはソルバ内部で実行してほしい）

【例2】表面ベースの結合拘束

■ 接触解析を次のように変えればOK

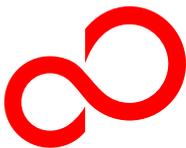
- 接触タイプのフラグを増やして、通常の接触と分岐すると良い
 - mContactDefの接触タイプCONTACTTIEDを使う

```
!CONTACT, TYPE=SSLID  
⇒!CONTACT, TYPE=TIED
```

- 接触探索…初回だけ実行、接触状態は変えない
- 拘束式…法線方向拘束を、全自由度の相対変位拘束に変える
 - 接触の拘束式： $g_{N,S} \equiv (\mathbf{x}^{(s)} - \mathbf{x}^{(P)}) \cdot \mathbf{n}_S = 0$
 - 結合の拘束式： $\mathbf{u}^{(s)} - \mathbf{u}^{(P)} = \mathbf{0}$

■ 当日発表内容の詳細

- INAGAKI, Kazuhisa, Gaku HASHIMOTO, and Hiroshi OKUDA.
"Interior point method based contact analysis algorithm for structural analysis of electronic device models." Mechanical Engineering Journal (2015).



FUJITSU

shaping tomorrow with you